

電子顕微鏡解析技術フォーラム

～「その場限り」という勿れ、その場計測—ミクロとマクロの接点—～

2026 年 1 月 16 日(金)

開催地：名古屋大学 EI 創発工学館 FUJI ホール（名古屋市千種区不老町）

日本顕微鏡学会・電子顕微鏡解析技術分科会では、機能性材料や電子デバイスの評価に関する身近な疑問をざっくばらんに話し合う場として、「電子顕微鏡解析技術フォーラム」の開催を企画しています。

今回の新春フォーラムでは、夏のフォローアップとして「その場観察」を取り上げ、チュートリアルではその場観察の基礎技術を振り返り、トピックスではより実践的な研究事例を紹介頂きます。

また、このフォーラムの特色である“ざっくばらんトーク”では、参加者の皆様が抱えている課題や疑問を発表していただき、それをもとに今後のご研究に役立つ議論を行います。

「その場観察」に携わっている皆様、これから取り組んでみたいとお考えの皆様、ぜひ奮ってご参加ください！

= プ ロ グ ラ ム =

■ チュートリアル ■※敬称略

・環境・エネルギー材料その場電子顕微鏡解析

竹口 雅樹(物質・材料研究機構)

■ トピックス ■※敬称略

・走査電子誘電率顕微鏡を用いた液中環境下での高コントラスト・非侵襲的その場観察 内山 博允(東レリサーチセンター)

・In-situ 加熱 TEM 観察の材料解析への応用

中村 和人(東ソー分析センター)

・クライオ電顕技術を用いた材料系試料のその場観察

稲葉 健介(日産アーク)

・低電子線耐性材料のその場損傷解析

吉田 要(JFCC)

■ ざっくばらんトーク ■

今回は「その場観察」をテーマに絞り、皆様からの疑問やご質問を募集いたします。実際の観察技法やデータ解析方法に関する疑問点から、最新技術に関するご質問まで、ぜひお気軽にお寄せください。

また今回は名古屋大学の超高圧電子顕微鏡施設の見学も予定しています

1. 主 催：公益社団法人 日本顕微鏡学会・電子顕微鏡解析技術分科会
2. 日 時：2026 年 1 月 16 日(金) 13:00 ～17:30 (予定) (意見交換会～20:00 予定)
3. 会場：名古屋大学 EI 創発工学館 FUJI ホール
4. 参加費：3,000 円(日本顕微鏡学会個人・法人・学生)、4,000 円(協賛会員)、5,000 円(会員外)
意見交換会参加費：2,000 円

※講演会参加費・意見交換会費は会員区分に依らず課税対象(10%税込)となります。

5. 定員：80 名
6. 申し込み期間：2025 年 12 月 1 日(月)～2026 年 1 月 8 日(木)(定員になり次第締め切ります)
7. 申し込み方法：12 月 1 日に電子顕微鏡解析技術分科会 HP 上にてお申込みフォームの URL を公開いたします。サイトにアクセスして頂き、必要事項をご記入の上、お申込みください。

HP：顕微鏡学会 電子顕微鏡解析技術分科会 <https://jsm-at.sakura.ne.jp/db/>

8. お問い合わせ先(事務局)：

日鉄テクノロジー(株) 水尾 有里 e-mail: mizuo.yuri.8dg@nstec.nipponsteel.com

電話：0439-80-2866 Fax：0439-80-2733



電子顕微鏡解析技術分科会責任者：和田 充弘(三井金属)

フォーラム実行委員長：高橋 知里(産総研)、副実行委員長：川元 寛章(日立ハイテク)

実行委員：石丸 雅大(サーモフィッシュサイエンティフィック)、遠藤 徳明(日本電子)、乾 光隆(セイコーエプソン)、木村 耕輔(東レリサーチセンター)、
工藤 修一(キオクシア)、志摩 会実佳(東芝ナノアナリシス)、丸山 秀夫(カネカテクノロジー)、水尾 有里(日鉄テクノロジー)、
宮澤 知孝(追手門学院大学)、武藤 俊介(名古屋大学)、村上 和歌子(リコー)、森 貴仁(ローム)、吉田 誠(旭化成)



日本顕微鏡学会 電子顕微鏡解析技術分科会